

受託試験料金表

1. 大型設備基盤センターの設備

(平成29年 4月)

受託試験料金(税込)には、同料金の30%に相当する「管理費」が加算されます。
ご相談・ご依頼の場合には、次のアドレス(kiki@adm.nitech.ac.jp)へご連絡ください。

(*1) 表示の他に、オプションがあります。

センター以外の設備については、「受託試験料金表 2. 大型設備基盤センター以外の設備」をご覧ください。

測定室名	装置名、型式	性能・機能 物理・表面計測系	受託試験料金(税込)
電子顕微鏡室	TEM, JEM-2010HR	加速電圧:200 kV、分解能:0.14 nm	基本料金:54,000円 追加料金:9,180円/時間
	TEM, JEM-2100	加速電圧:200 kV、分解能:0.23 nm	基本料金:54,000円 追加料金:9,180円/時間
	FE-TEM, JEM-2100F	加速電圧:200 kV、STEM、EDS、EELS	基本料金:54,000円 追加料金:9,180円/時間
	3D-TEM, JEM-z2500	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 加速電圧:200 kV 格子像分解能:0.1 nm	TEMのみ 基本料金:54,000円(受託試験) 追加料金:9,180円/時間 +EDS、3D他について、 事前協議により料金を設定 (*1)
	SEM, JSM-6510	二次電子分解能:3 nm (30 kV)、8 nm (3 kV) 内部起電力像測定用プローブシステム付き	2,160円/時間
	L-FE-SEM, JSM-7800F	加速電圧:0.01~30 kV LED、UED (UEDフィルター電圧可変機能組込み) エネルギー分散形X線元素分析装置/カソードルミネセンス分析装置付き	基本料金:54,000円 追加料金:17,820円/時間
	Nano-TA, VESTA	分解能(高)、測定範囲:>100 nm、150 μm x 150 μm 分解能(低)、測定範囲:>1.5 μm、12 mm x 8 mm 測定温度範囲:室温~400°C、プローブ径:<30 nm 転移温度マッピング、他	基本料金:108,000円 (但し、プローブは利用者負担) 追加料金:5,400円/時間
	FIB, EM-9320FIB	加速電圧:0.5~30 kV、ビーム電流:30 nA (30 kV) 分解能:6 nm (30 kV)、加工形状:矩形、ライン、スポット	基本料金:10,800円/1試料 追加料金:2,700円/時間
	凍結試料作製装置 EM-19500 JFD II	真空度: 5×10^{-5} Pa以下、温度制御:+40~-170°C 試料傾斜角度:0~90°、蒸着材料:Pt-C、C	基本料金:10,800円 (*1) 追加料金:3780円/時間
	イオンスライサ EM-09100IS	傾斜角:最大±6° エッチングレート:5 μm/min (Si換算)	基本料金:10,800円/1試料 追加料金:2,160円/時間
	複合ビーム加工観察装置 JIB-4500	FIB部:イオン源:Ga液体イオン源、ビーム電流:0.5~30000 pA SEM部:Lab6-フィラメント、像分解能:2.5 nm 特徴:SIM像とSEI像もしくはBEI像を同時に観察可能	基本料金:10,800円 追加料金:2,700円/時間
軟X線分光室	SXES, JXA-8230	波長分散型分光器(4CH)、軟X線分光器(1CH) エネルギー分散形X線元素分析装置	基本料金:54,000円 追加料金:17,820円/時間
X線マイクロ アナライザー室	FE-EPMA, JXA-8530F	波長分散型X線分光器(3CH) エネルギー分散形X線元素分析装置(2CH)	基本料金:18,360円 追加料金:5,940円/時間
	FE-SEM, JSM-7001F	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 結晶方位解析システム	基本料金:18,360円 追加料金:5,940円/時間
	SPM, JSPM-5200	分解能 水平:0.1 nm 垂直:0.01 nm	基本料金:8,100円 追加料金:2,700円/時間
X線分析室	XRD, RINT-2100	X線源出力:2 kW、モノクロメータ付属	基本料金:21,600円 追加料金:10,800円/時間
	XRD, SmartLab	X線源出力:9 kW、回転対陰極式	基本料金:21,600円 追加料金:10,800円/時間
オージェ分析室	AES, JAMP-9500F	二次電子分解能:3 nm (25 kV、10 pA) オージェ分析時最小プローブ径:8 nm (25 kV、1 pA) エネルギー分解能:0.05~0.6%	基本料金:18,360円 追加料金:5,940円/時間
二次イオン 質量分析室	TOF-SIMS, PHI TRIFTV nano TOF	質量分解能(無機材料):9,000M/Δμ以上 質量分解能(有機材料):9,000M/Δμ以上 (PET(m/z 104)にて)	基本料金:54,000円 追加料金:17,820円/時間
	SIMS, SIMS-4000	縦方向分解能:0.02 μm 横方向分解能:0.1 μm	基本料金:18,360円 追加料金:5,940円/時間
光電子分光室	XPS, PHI 5000	X線源:単色化された走査型(ターゲット:AL-Kα) 走査範囲:1 mm、最小ビーム径:10 μm エネルギーアナライザー:静電半球型	基本料金:18,360円 追加料金:5,940円/時間